○国立大学法人長岡技術科学大学受託試験等取扱規程

（平成16年４月１日規程第36号）

改正　平成17年９月30日規程第12号　平成20年２月27日規程第18号
平成27年３月26日規程第11号　平成29年３月31日規程第13号
令和２年12月28日規程第７号　令和４年１月12日規程第10号
令和５年１月24日規程第14号

（趣旨）

第１条　国立大学法人長岡技術科学大学（以下「本学」という。）において、学外からの依頼により行う試験、分析等（以下「受託試験等」という。）の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

（受託試験等）

第２条　受託試験等は、次の各号に掲げるとおりとする。

一　別表第１に定めるもの

二　別表第２に定める機器を使用した分析、測定等

三　前２号に掲げるもののほか、学長が受託することが適当であると認めたもの

（受託料金）

第３条　受託試験等に係る料金（以下「受託料金」という。）は、次の各号に掲げるとおりとする。

一　別表第１に掲げるものは、同表受託料金による。

二　別表第２に掲げるものは、同表機器使用料金による。

三　前条第３号に掲げるものは、学長が別に定めるものとする。

（受託試験等の依頼）

第４条　受託試験等を依頼しようとする者（以下「依頼者」という。）は、受託試験等依頼書（別紙様式第１）に、所定の事項を記入の上、必要な資料を添えて、学長に提出しなければならない。

（承認要件及び承認）

第５条　学長は、前条の受託試験等の依頼を受けたときは、次の各号に掲げる要件に合致する場合に限り、受託の承認をするものとする。

一　教育研究上有意義であること。

二　本学の教育、研究その他運営上支障を生じるおそれがないこと。

三　受託するに不適当な条件等が付されていないこと。

２　前項の承認にあたり、当該受託試験等において、学内共同教育研究施設が管理する機器を使用する場合にあっては、当該施設の長と協議するものとする。

（承認等の通知）

第６条　学長は、前条により受託を承認したときは、依頼者に受託試験等受託承認通知書（別紙様式第２）をもって通知するものとする。

（受託料金の納付）

第７条　依頼者は、前条による承認の通知を受けたときは、当該受託試験等の開始前に第３条で定める受託料金を納付しなければならない。ただし、依頼者が国、地方公共団体その他の公的機関である場合は、当該受託試験等完了後に納付することができる。

２　納付済の料金は、原則として返還しない。

（受託試験等の結果通知）

第８条　学長は、受託試験等が完了したときは、その結果を依頼者に受託試験等結果報告書（別紙様式第３）をもって通知するものとする。

（試験試料の措置）

第９条　依頼者が受託試験等のため提出した試験試料（以下「試料」という。）は原則として返還しないものとする。ただし、試験の開始前に返還の申出があり学長の承認を得たものはこの限りでない。

（諸費用の負担）

第10条　受託試験等に係る試料の搬入搬出に必要な費用は、すべて依頼者の負担とする。

（試料の損害責任）

第11条　天災地変その他不可抗力による試料の損害については、本学はその責めを負わないものとする。

（雑則）

第12条　この規程に定めるもののほか、受託試験等の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

附　則

この規程は、平成16年４月１日から施行する。

附　則（平成17年９月30日規程第12号）

この規程は、平成17年10月１日から施行する。

附　則（平成20年２月27日規程第18号）

この規程は、平成20年２月27日から施行し、平成20年２月１日から適用する。

附　則（平成27年３月26日規程第11号）

この規程は、平成27年４月１日から施行する。

附　則（平成29年３月31日規程第13号）

この規程は、平成29年４月１日から施行する。

附　則（令和２年12月28日規程第７号）

この規程は、令和２年12月28日から施行する。

附　則（令和４年１月12日規程第10号）

この規程は、令和４年４月１日から施行する。

附　則（令和５年１月24日規程第14号）

この規程は、令和４年１月24日から施行する。

別表第１（第２条、第３条関係）

機械試験

受託試験等	試験等単位	受託料金
		円
細骨材比重試験	１試料	15,500
細骨材吸水量試験	１試料	15,500
金属材料引張試験	１試料（１本）	4,900
コンクリート圧縮試験	１試料（１本）	2,200
骨材単位容積質量試験	１試料	12,500
紙・金属・樹脂等の複合板材に関する曲げ成形試験	１試験	54,200
紙・金属・樹脂等の複合板材に関する面外圧試験	１試験	85,400
紙・金属・樹脂等の複合板材に関する面外引剥試験	１試験	48,100
紙・金属・樹脂等の複合板材に関する断裁・押抜試験	１試験	55,500
紙・金属・樹脂等の複合板材に関する面内引張試験	１試験	57,700

備考

（注１）　別途、電気料金、消耗品等が必要な場合は追加料金が発生する。

別表第２（第２条、第３条関係）

分析試験

（時間単価）

装置名	機器使用料金（依頼測定）	機器使用料金（共同研究測定）	備考
電界放出形電子線マイクロアナライザ FE-EPMA	円（税抜）	円（税抜）	
	6,000	10,000	
JEOL JXA-iHP200F	10,000	14,000	
電子線マイクロアナライザ EPMA	3,400	7,400	
Shimadzu EPMA-1600	4,800	8,800	
グロー放電発光分析装置 GD-OES	3,800	7,800	
Horiba GD-Profiler２	5,600	9,600	
全自動光電子分光装置 XPS/UPS	6,000	10,000	XPSのみ、その他のオプション利用は別途相談
Thermo Fisher Scientific Nexsa	10,000	14,000	
X線光電子分光装置 XPS	3,400	7,400	

JEOL JPS-9010TR	4,800	8,800	
オージェ電子分光装置 AES JEOL JAMP-9500F	5,000	9,000	
	8,000	12,000	
フーリエ変換赤外分光装置 FT-IR JASCO FT/IR-4100	2,800	6,800	
	3,600	7,600	
レーザーラマン分光装置 LRS JASCO NRS-7200	3,400	7,400	
	4,800	8,800	
電子スピン共鳴分光装置 ESR JEOL JES-RE２X	2,400	6,400	
	2,800	6,800	
粉末X線回折装置 Powder XRD Rigaku SmartLab ３kW	3,400	7,400	
	4,800	8,800	
In-plane型X線回折装置 In-plane XRD Rigaku SmartLab ９kW	3,600	7,600	
	5,200	9,200	
低温X線回折装置 Low temperature XRD Rigaku SmartLab ９kW	3,600	7,600	低温測定時は別途液体窒素代
	5,200	9,200	
蛍光X線分析装置 XRF Rigaku ZSX Primus II	3,400	7,400	
	4,800	8,800	
透過電子顕微鏡 TEM Hitachi HT7700	6,000	10,000	
	10,000	14,000	
電界放出形透過電子顕微鏡 FE-TEM JEOL JEM-2100F	6,000	10,000	
	10,000	14,000	
冷陰極電界放出形走査電子顕微鏡 Cold FE-SEM Hitachi SU8230	6,000	10,000	
	10,000	14,000	
ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡 Schottky FE-SEM JEOL JSM-IT800 (SHL)	6,000	10,000	
	10,000	14,000	
走査電子顕微鏡 SEM Hitachi FlexSEM1000 II	3,600	7,600	
	5,200	9,200	
cryo走査電子顕微鏡 cryoSEM JEOL JSM-IT200	3,600	7,600	
	5,200	9,200	
卓上走査電子顕微鏡 DesktopSEM Hitachi TM3030Plus	3,000	7,000	cool stage利用時は別途相談
	4,000	8,000	
卓上走査電子顕微鏡 BenchtopSEM JEOL JCM-6000Plus	3,200	7,200	
	4,400	8,400	
複合ビーム加工観察装置 FIB/FE-SEM JEOL JIB-4700F	7,000	11,000	
	12,000	16,000	
集束イオンビーム加工装置 FIB Hitach FB2200	7,000	11,000	
	12,000	16,000	

イオンミリング Ion Milling Machine Hitachi IM4000Plus	3,000	7,000	
	4,000	8,000	
ウルトラミクロトーム Ultramicrotome Leica EM UC７	3,600	7,600	
	5,200	9,200	
SEM用イオンミリング装置 SEM Mill Fischione Instruments Model1061	3,000	7,000	
	4,000	8,000	
ICP発光分光分析装置 ICP-OES Shimadzu ICPE-9820	4,000	8,000	
	6,000	10,000	
原子吸光分光光度計 AAS Shimadzu AA-7000	3,200	7,200	
	4,400	8,400	
イオン化エネルギー測定装置 イオン化エネルギー Bunkoukeiki BIP-KV100J	3,600	7,600	
	5,200	9,200	
熱分解ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計 熱分解GC-TOF-MS JEOL JMS-T200GCx-plus	3,600	7,600	
	5,200	9,200	
X線マイクロCTスキャン X-ray CT Bruker SkyScan1172	6,000	10,000	
	10,000	14,000	

備考

（注１）　上段は高等教育機関その他学長が認める機関等、下段は上段に含まれない機関等の料金とする。

（注２）　別途、電気料金、前処理、加工、消耗品等が必要な場合は追加料金が発生する。

（注３）　依頼測定とは技術職員による分析、測定等であり、専門的知識の提供を含まない。

（注４）　共同研究測定とは教員、技術職員による分析、測定等であり、専門的知識の提供を含む。

別紙様式第１（第４条関係）

受託試験等依頼書
［別紙参照］

別紙様式第２（第６条関係）

受託試験等受託承認通知書
［別紙参照］

別紙様式第３（第８条関係）

受託試験等結果報告書
［別紙参照］